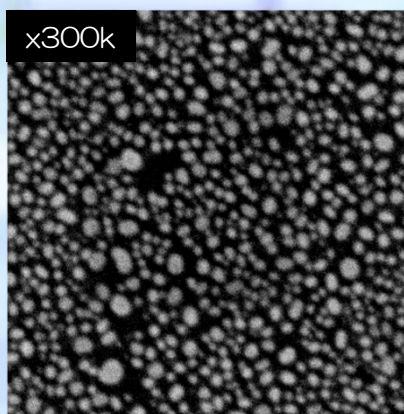


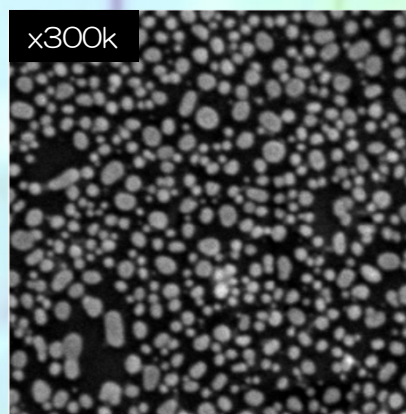
HOLON CD-SEM Z7

ナノワールドを観察・計測するCD-SEM！
マスターモールド・樹脂フィルムの検査を実現！
高分解能・低チャージ・高スループット

ナノパターンを高精度で計測するためには、高倍率で高精細な画像の取得が必要です。
この課題を解決するため、Z7では制御回路の全面改良により、ノイズ低減を行い、画質を更に向上させました。



EMU-270A

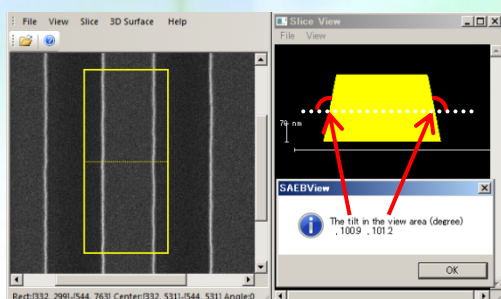


Z7

《特長》

- ナノパターンの高速・高精度計測が可能
- 画像ピクセル数：4,000 × 4,000 pixels (MAX)
- 様々なサンプルにも対応 (Qzモールド・PETフィルム・自己組織化膜 など)
- 多彩なアプリケーション (多点計測・ユニフォミティ計測・輪郭抽出・欠陥レビュー)
- 分割型検出器によりパターンエッジ角度計測・3D表示が可能 (オプション)

パターンエッジ
角度計測例

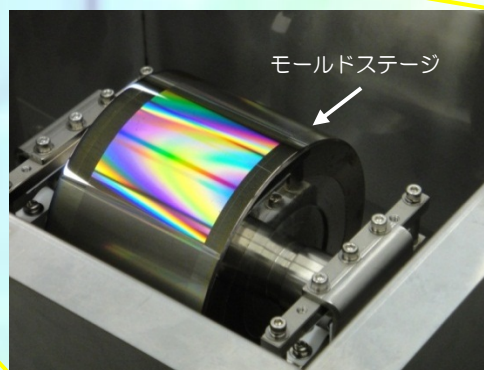
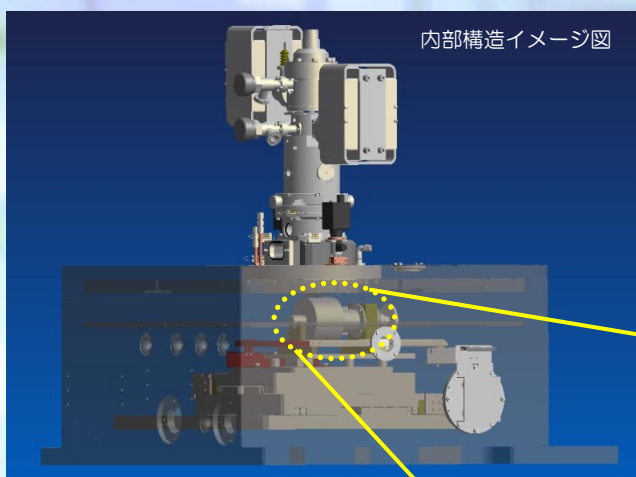


Roll Mold CD-SEM

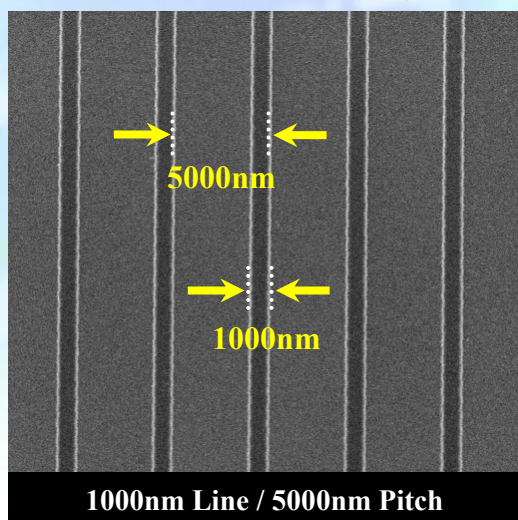
New

HOLON Roll-SEM

世界初、ロールモールド用CD-SEMを商品化！
ロール表面のナノパターンの観察・計測が可能！
ロール検査でフレキシブルエレクトロニクスに貢献！



SEM観察/測定画像例



《特長》

- ロールモールドを直接観察・自動計測が可能
- 非破壊・無蒸着で観察・計測が可能
- 回転式モールドステージ採用
- 多様なCD-SEMソフトウェアに対応

※本製品は、受注生産となります。